

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH • Merianstr. 28 • 63069 Offenbach

NXP Semiconductors Czech
Republic s.r.o.
1. Maje 1009
756 61 ROZNOV POD RADHOSTEM
Czech Republic

Offenbach, 2021-02-24

Your ref.
Jozef Sedlak

Your letter
2020-12-21

Our ref. - please indicate
5016540-4970-0008/280532
TL2/scb

Contact
Mr. Dipl.-Ing. Schildbach
Tel +49 69 8306 524
Fax +49 69 8306 789
joachim.schildbach@vde.com

Translation: In any case the German version shall prevail

PRÜFBERICHT
zur Information des Auftraggebers

Test Report for the Information of the applicant

Produkt / Product: Peripherals/Common for Micro Controllers

Typ / Type: with CM0+/CM33/CM4/CM7 core

Dear Sirs,

dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Abschnitten von Normen festzustellen.

Die Prüfung wurde durchgeführt vom 2021-02-17 bis 2021-02-24.

This test report contains the result of a singular investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the accordance with the thereafter listed standards or clauses of standards resp. The testing was carried out from 2021-02-17 to 2021-02-24.

Der Prüfbericht berechtigt Sie nicht zur Benutzung eines Zertifizierungszeichens des VDE und berücksichtigt ausschließlich die Anforderungen der unten genannten Regelwerke.

The test report does not entitle for the use of a VDE Certification Mark and considers solely the requirements of the specifications mentioned below.

Wenn gegenüber Dritten auf diesen Prüfbericht Bezug genommen wird, muss dieser Prüfbericht in voller Länge an gleicher Stelle verfügbar gemacht werden.

Whenever reference is made to this test report towards third party, this test report shall be made available on the very spot in full length.

I BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Produkt / *Product:* Selbst-Diagnose-Routinen für Milro-Controller mit ARM CM0+ Core
Self-Diagnostic Routines for Micro Controllers with ARM CM0+ Core

Typ / Type: Dateiname / File name Version / Version

	iec60730b_clock.c	4.x
	iec60730b_dio.c	4.x
	iec60730b_dio_ext.c	4.x
	iec60730b_aio.c	4.x
	IEC60730_B_tsi.c	4.x
	IEC60730B_M0_COM_IAR_v4_1.a*	4.x
	IEC60730B_M0_COM_KEIL_v4_1.lib*	4.x
	IEC60730B_M4_M7_COM_IAR_v4_1.a*	4.x
	IEC60730B_M4_M7_COM_KEIL_v4_1.lib*	4.x
	IEC60730B_M33_COM_IAR_v4_1.a*	4.x
	IEC60730B_M33_COM_KEIL_v4_1.lib*	4.x
	libIEC60730B_M0_COM_MCUX_v4_1.a*	4.x
	libIEC60730B_M4_M7_COM_MCUX_v4_1.a*	4.x
	libIEC60730B_M33_COM_MCUX_v4_1.a*	4.x
Remark:	The files marked with * are object code files.	
	The files referenced under this test report are also suitable for device families with CM0+/CM33/CM4/CM7 core referenced under VDE folders: - 5016540-4970-0002 for features for devices with ARM CM4 or CM7 core with its actual test report. - 5016540-4970-0004 for features for devices with ARM CM0+ core with its actual test report. - 5016540-4970-0005 for features for devices with ARM CM33 core with its actual test report.	

II NORMEN / STANDARD

Prüfnorm(en) / Standard(s) used:

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2020-08 EN 60335-
1:2012+AC+A11+A13+A1+A2+A14:2019
Annex R Annex R

DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2017-05 EN 60730-1:2016
EN 60730-1:2016/A1:2019
Annex H Annex H

IEC 60335-1:2010
IEC 60335-1:2010/AMD1:2013
IEC 60335-1:2010/AMD2:2015
Annex R

IEC 60730-1:2013
IEC 60730-1:2013/AMD1:2015
IEC 60730-1:2013/AMD2:2020
Annex H

III PRÜFUNG / TEST

Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen nach Tabelle R.1 / H.1 der unter II benannten Normen. /

The self-diagnostic routines mentioned under I are foreseen for following measures of table R.1 / H.1 of the standards mentioned under II.

Dateiname / File name	Maßnahme / Measure
iec60730b_clock.c	3.0 Clock
iec60730b_dio.c iec60730b_dio_ext.c	7.1 Digital I/O (for output mode only)
iec60730b_aio.c IEC60730_B_tsi.c	7.2.1 A/D- and D/A-converter

Zu Details der Prüfungen siehe VDE-Prüfbericht /
For details of testing see VDE Test Report:

280532-TL2-1

IV ERGEBNIS / RESULT

Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen erfüllen die Anforderungen der unter II benannten Normen. Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen können zum Aufbau einer Selbst-Test-Bibliothek gemäß der unter II benannten Normen verwendet werden. /

The self-diagnostic routines mentioned under I fulfill the requirements of the standards mentioned under II. The self-diagnostic routines mentioned under I are suitable to be used to create a self-test library according the standards mentioned under II.

Best regards

VDE Testing- and Certification Institute
Appliances and Systems for House and Commercial Use



Dipl.-Ing. (FH) K. Tas



Dipl.-Ing. (FH) J. Schildbach